

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFÉDÉRATION SUISSE CONFEDERAZIONE SVIZZERA

REC'D 3 0 AUG 2000

PCT

WIPO

CH00/00451

Bescheinigung

Die beiliegenden Akten stimmen mit den ursprünglichen technischen Unterlagen des auf der nächsten Seite bezeichneten Patentgesuches für die Schweiz und Liechtenstein überein. Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden ein einheitliches Schutzgebiet. Der Schutz kann deshalb nur für beide Länder gemeinsam beantragt werden.

4

Attestation

Les documents ci-joints sont conformes aux pièces techniques originales de la demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein spécifiée à la page suivante. La Suisse et la Principauté de Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection. La protection ne peut donc être revendiquée que pour l'ensemble des deux Etats.

Attestazione

Gli uniti documenti sono conformi agli atti tecnici originali della domanda di brevetto per la Svizzera e il Liechtenstein specificata nella pagina seguente. La Svizzera e il Principato di Liechtenstein formano un unico territtorio di protezione. La protezione può dunque essere rivendicata solamente per l'insieme dei due Stati.

Bern.

2 4. Aug. 2000

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Patentverfahren Administration des brevets Amministrazione die brevetti

Hollett Rolf Hofstetter le a proprieté Inteller

<u>.</u>

Patentgesuch Nr. 1999 1569/99

HINTERLEGUNGSBESCHEINIGUNG (Art. 46 Abs. 5 PatV)

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum bescheinigt den Eingang des unten näher bezeichneten schweizerischen Patentgesuches.

Titel:

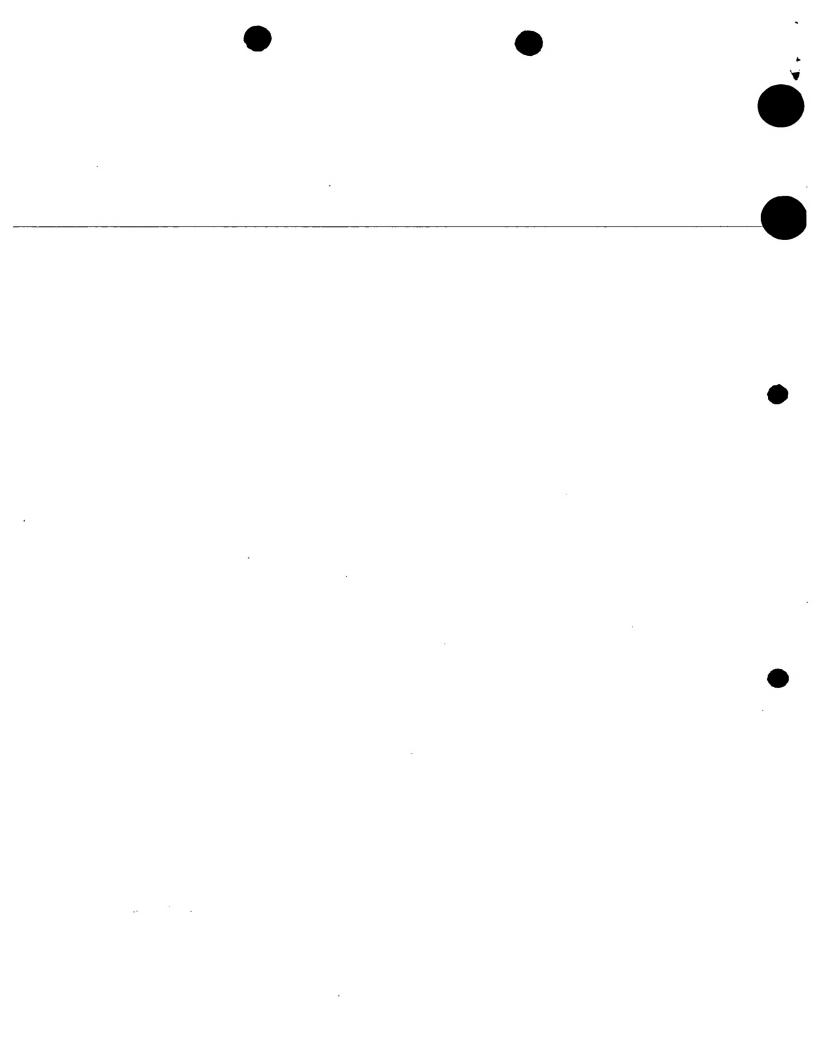
Handhabungsvorrichtung zur Bereitstellung eines Wafer-Stapels.

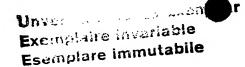
Patentbewerber: Tec-Sem AG Lohstampfestrasse 11 8274 Tägerwilen

Vertreter: R. A. Egli & Co. Patentanwälte Horneggstrasse 4 8008 Zürich

Anmeldedatum: 27.08.1999

Voraussichtliche Klassen: B65G, H01L







Handhabungsvorrichtung zur Bereitstellung eines Wafer-Stapels

5 Die Erfindung betrifft eine Handhabungsvorrichtung für Wafer (Halbleiterscheiben), welche eine Lagereinrichtung aufweist, in der mehrere Wafer mit ihren Oberflächen im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet, hintereinander und ausserhalb eines Transportbehälter anordenbar sind, sowie mit einer Greifvorrichtung versehen ist, mit welcher einzelne Wafer aus der Lagereinrichtung entnehmbar und/oder in sie einsetzbar sind.

Grundlage für die Herstellung elektronischer Bauteile sind in bestimmter Weise vorbearbeitete Halbleiterscheiben, soge-15 nannte Wafer. Für deren Oberflächenbearbeitung müssen sie verschiedene Prozessstufen durchlaufen. Dabei werden Roh-Wafer (unprozessierte Wafer) hergestellt und in der Regel zwischen dem Durchlaufen von einzelnen Prozessstufen in Transport- und Aufbewahrungsbehältern zwischengelagert. Für 20 den eigentlichen Bearbeitungsprozess müssen diese un- bzw. erst teilweise prozessierten Wafer dem Behälter entnommen werden, einer Vorrichtung zur Durchführung des Bearbeitungsprozesses zugeführt und anschliessend wieder in einen Behälter abgelegt werden. Die Anzahl der in einem Behälter vorge-25 sehenen Wafern wird auch als "Batch" (Stapel) bezeichnet. Die Batch-Grösse ist genormt und beträgt üblicherweise 25 (oder 13) Wafer.

Zwischenlagerung besteht darin, dass die Wafer von Verunreinigungen und Schmutz ferngehalten werden müssen. Bereits
kleinste Verunreinigungen durch Staub oder sonstige Partikel
erzeugen eine Schädigung des entsprechenden Bereiches der
Wafer-Oberfläche. Dies kann zu erheblichen Ausschussraten

der aus diesen Wafern hergestellten Endprodukte führen. Deshalb erfolgt die Verarbeitung üblicherweise in sogenannter Reinraumtechnik, d.h. die Verarbeitungszonen müssen eine bestimmte, festgelegte Reinheit in Bezug auf diese Schmutzpar-5 tikel aufweisen. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für die Zwischenlagerung, d.h. die Aufbewahrungsbehälter.

Es hat sich gezeigt, dass qualitative Unterschiede bei Wafern eines Batches entstehen können, wenn diese stets in der 10 gleichen Reihenfolge die einzelnen Prozessstufen durchlaufen. Es kann deshalb von Vorteil sein, wenn die Reihenfolge der Wafer innerhalb eines Batches verändert wird. Um Wafer an unterschiedlichen Stellen eines Batches anzuordnen sind bereits Vorrichtungen bekannt geworden, bei denen eine als 15 Einzelgreifer ausgebildete Greifvorrichtung jeweils einen Wafer aus einem in einer Kassette angeordneten Batch entnimmt und in einer anderen Kassette - oder sonstigen Halteeinrichtung - an einem anderen Kassettenplatz ablegt. Das Batch ist für den nächsten Prozess zusammengestellt, sobald der Einzelgreifer sämtliche Wafer jeweils einzeln entnommen 20 und in der anderen Kassette an einer vorbestimmten Stelle abgelegt hat. Diese Vorrichtung hat jedoch den Nachteil, dass die Zusammenstellung des Batches relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Ausserdem ist es mit dieser Vorrichtung kaum möglich, aus unterschiedlichen Batches einen neuen Batch zu-25 sammenzustellen.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde eine Vorrichtung zu schaffen, mit der sich ein Stapel von zu bear-30 beitenden Wafern in beliebiger aber vorbestimmter Reihenfolge möglichst effizient zusammenstellen lässt.

Die Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs erwähnten Art dadurch gelöst, dass die Greifvorrichtung mehrere

Greifer aufweist, welche gemeinsam verfahrbar jedoch unabhängig voneinander betätigbar sind, wobei durch die Betätigung eines Greifers jeweils zumindest ein Wafer erfassbar und/oder in die Lagereinrichtung einsetzbar ist. Hierdurch ist es möglich, gegenüber vorbekannten gattungsgemässen Vorrichtungen die für die Zusammenstellung eines Wafer-Batches erforderlichen Verfahrwege erheblich zu verkürzen.

Bei der erfindungsgemässen Handhabungsvorrichtung können mit mehreren, einzeln betätigbaren Greifern zuerst mehrere Wafer erfasst und aus der Lagereinrichtung entnommen und erst anschliessend gemeinsam in eine andere Halteeinrichtung eingesetzt werden. Der Verfahrweg zwischen der Lagereinrichtung und der Halteeinrichtung kann somit umso stärker verkürzt werden, je mehr Wafer die Greifvorrichtung mit einzeln betätigbaren Greifern aufnehmen kann, bevor sie diese an die Halteeinrichtung übergibt. Die Wafer sollten deshalb auch bereits bei der Entnahme aus der Lagereinrichtung, in der Greifvorrichtung in der Reihenfolge angeordnet sein, welche 20 sie auch in der Halteeinrichtung bzw. für den nächsten Prozess aufweisen sollen. Dies lässt sich besonders einfach erreichen, wenn über eine Steuerung einer erfindungsgemässen Handhabungsvorrichtung frei wählbar ist, welcher Wafer mit welchem Greifer erfasst wird.

25

30

35

In einer bevorzugten Ausführungsform entspricht die Anzahl der in einer Greifvorrichtung vorhandenen Greifern, der Anzahl an Wafern eines Waferbatches. Die Greifer sind so ausgeführt, dass auch eine Verdichtung eines Waferstapels durchgeführt werden kann. Unter Verdichtung ist zu verstehen, dass zwischen jeweils zwei Wafern eines ersten Stapels oder Batches ein oder mehrere Wafer von ein oder mehreren anderen Batches eingeschoben werden sollen. Eine solche Verdichtung ist oftmals erwünscht, um die Wirtschaftlichkeit von Prozessanlagen zu erhöhen, indem mehr als nur ein Waferbatch gleichzeitig bearbeitet wird.

Eine konstruktiv besonders unaufwendige Ausführungsform einer erfindungsgemässen Greifvorrichtung kann vorsehen, dass Greifer in zwei Endlagen schwenkbar sind, wobei in einer er-5 sten Endlage, nämlich einer Leerposition des Greifers, sich kein Wafer im Greifer befindet, und in einer zweiten Endlage, einer Transportposition für Wafer, ein Wafer im Greifer angeordnet ist. Um einen Wafer aus der Lagereinrichtung zu entnehmen ist der entsprechende Greifer von seiner Leerposition in seine Greifposition zu überführen. Bei dieser Bewegung erfasst der Greifer den Wafer und führt ihn aus der Lagereinrichtung heraus. Umgekehrt übergibt der Greifer bei der Bewegung von der Transportposition in die Leerposition den jeweiligen Wafer an die Lagereinrichtung. Beim Verfahren der Greifvorrichtung entlang der Lagereinrichtung befindet sich jeder der Greifer in einer der beiden Endlagen.

15

20

35

Eine weitere zweckmässige Ausgestaltung der Greifvorrichtung kann vorsehen, dass Greifer der Greifvorrichtung, unabhängig von anderen Greifern einzeln und im Wesentlichen parallel zu den Oberflächen der Wafer sowie quer zur Verfahrrichtung der Greifvorrichtung geradlinig, d.h. translatorisch, bewegbar sind. Auch bei dieser Ausführungsform kann jeder Greifer der Greifvorrichtung in eine Leer- und in eine Greifposition überführbar sein und hierbei die gleichen Funktionen ausüben, wie die schwenkbare Ausführungsform der Greifer.

Die Aufgabe wird auch durch eine Speichervorrichtung für eine Zwischenlagerung von Wafern gelöst, die ein Gehäuse auf-30 weist, das einen Innenraum ausbildet in dem mehrere Speicherplätze für Transportbehälter von Wafern vorhanden sind, die mit einem Manipulator versehen ist, welcher die Transportbehälter handhabt, wobei zumindest ein Teil des Innenraumes als Reinraumbereich ausgebildet ist, in dem Wafer ausserhalb von Transportbehältern handhabbar und in einer La-



gereinrichtung zwischenlagerbar sind, und die im Innenraum zumindest eine erfindungsgemässe Greifvorrichtung aufweist.

Durch die Erfindung lässt sich somit die Funktionalität von Speichervorrichtungen erheblich steigern. Es ist nun möglich, in die Speichervorrichtung Transportbehälter mit einem Wafer-Batch einzulagern und den gleichen Transportbehälter mit einem völlig anders zusammengestellten Wafer-Batch zu entnehmen, der zur weiteren Bearbeitung sofort einer Prozessanlage zugeführt werden kann. Sollte bisher die Reihenfolge der Wafer in einem Wafer-Batch verändert oder einzelne Wafer des Batches ausgetauscht werden, so musste dies in einer gesonderten Anlage durchgeführt werden. Dies benötigte zusätzliche Stellfläche. Da in den Halbleiterfabriken Stellfläche aufgrund den in jeder Fabrik zu schaffenden Reinraumbedingungen besonders teuer ist, kann durch die Integration der erfindungsgemässen Greifvorrichtung die insgesamt erforderliche Stellfläche vorteilhaft verringert werden.

15

20 Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur Zusammenstellung eines Wafer-Batches. Bei vorbekannten Verfahren ist vorgesehen, dass in einem Zyklus zunächst jeweils ein Wafer mit einem Einzelgreifer aus einem in einer Lagereinrichtung angeordneten Waferstapel entnommen und in einer Halteeinrichtung angeordnet wird. Dieser Zyklus wird mit anderen Wafern, unter Verwendung des stets gleichen Greifers so lange wiederholt, bis der Wafer-Batch zusammengestellt ist. In Abkehr hiervon ist bei einem erfindungsgemässen Verfahren vorgesehen, dass mit einer Greifvorrichtung nachein-30 ander mehrere Wafer, vorzugsweise ein vollständiges Wafer-Batch, aus der Lagereinrichtung entnommen und erst danach die entnommenen Wafern von der Greifvorrichtung, vorzugsweise gleichzeitig, an eine Halteeinrichtung übergeben werden. Mit dem erfindungsgemässen Verfahren kann die zur Zusammenstellung eines Waferbatches erforderliche Zeit erheblich re-35 duziert werden.



Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

5_	Die Erfindung w	uird anhand den in den Figuren schematisch
	dargestellten A	usführungsbeispielen näher erläutert; es zei-
10	Fig. 1	eine perspektivische Darstellung einer erfindungsgemässen Speichervorrichtung;
	Fig. 2	eine Grundrissdarstellung der in Fig. 1 gezeigten Speichervorrichtung;
15	Fig. 2a	eine Seitenansicht der erfindungsgemässen Speichervorrichtung aus Fig. 1;
20	Fig. 3	eine stark schematisierte perspektivische Darstellung einer vor einer teilweise darge stellten Lagereinrichtung angeordneten erfin dungsgemässen Greifvorrichtung;
25	Fig. 3a	eine stark schematisiert perspektivische Dar stellung einer vor einer Transferstation an geordneten erfindungsgemässen Greifvorrich tung;
30	Fig. 4	ein einzelner Greifer der Vorrichtung aus Fig. 3 in einer Greifposition;
30	Fig. 5	zwei Endlagen des Greifers aus Fig. 4;
35	Fig.6	eine Vorderansicht eines weiteren Aus- führungsbeispiels einer Greifvorrichtung, bei der ein Greifer in zwei verschiedenene Endlagen gezeigt ist.



Die Fig. 1 und 2 zeigen eine Speichervorrichtung 1 (sogenannter "Stocker") für Wafer. Durch ein Gehäuse 2 der Speichervorrichtung 1 wird ein Innenraum ausgebildet, in dem Reinraumbedingungen herrschen. Die Speichervorrichtung 1weist zwei Schleusenplätze 3, 4 auf, auf denen Transportbehälter für Wafer zur Ein- oder Ausgabe von der Speichervorrichtung positioniert werden können. Transportbehälter können geschlossene Boxen oder offene Kassetten sein. Am Schleusenplatz 3 ist eine nicht dargestellte Transporteinrichtung vorhanden, mit der ein Transportbehälter 6 durch Öffnen einer Schleusentür 5 ins Innere der Speichervorrichtung 1 einführbar bzw. aus der Speichervorrichtung 1 herausführbar ist. Unmittelbar gegenüber der Schleusenplätze 3, 4 15 befinden sich fünf in etwa zueinander halbkreisförmig angeordnete Speicherzeilen 7, 8, 9, 10, 11. Jede der vier ersten Speicherzeile weist eine bestimmte Anzahl übereinander angeordnete Speicherplätze für Transportbehälter 6 auf. Die fünfte Speicherzeile 7 weist einen Speicherplatz weniger als 20 die anderen Speicherzeilen auf, da im Bereich unter ihr die in einem Transportbehälter 6 angeordneten Wafer durch ein Übergabemodul vom Stocker an eine Anlage 16 zur Handhabung von Wafern übergeben werden. Ein in vertikaler Richtung (Z-Achse) verfahrbarer, als Knickarmroboter 14 ausgebildeter Manipulator, handhabt die Transportbehalter 6, indem er die Transportbehälter von der Schleusentür 5 aus in einen Speicherplatz absetzt bzw. von letzterem zur Schleusentür 5 überführt.

30 An einer der Schleusentür 5 gegenüberliegenden Wandfläche 15 der Speichervorrichtung 1 ist die Anlage 16 zur Handhabung eines Waferbatches vorgesehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um zwei parallel zueinander ausgerichtete Rollen 17, 18, an deren Umfang nicht näher dargestellte Aufnahmen zum Halten der Wafer in einer vertikalen Position vorgesehen sind. Die Wafer werden mittels einem vertikal verfahr-

baren Batch-Greifer vom Transportbehälter an die horizontal verfahrbaren Rollen 17, 18 übergeben und dort in Aufnahmen eingesetzt.

Die Rollen sind gemeinsam in Y-Richtung verfahrbar, um die Wafer in einer von vier punktiert dargestellten Stationen anzuordnen. Bei jeder Station befindet sich ein nicht näher gezeigter vertikal (Z-Achse) verfahrbarer Halterechen. Jeder der Halterechen kann durch vertikales verfahren zwischen den Rollen 17, 18 von diesen die Wafer übernehmen bzw. an sie übergeben. Der Aufbau und die Funktionsweise einer solchen Anlage ist in der europäischen Patentanmeldung Nr. 97 115 686.4 vom 10.09.1997 der Anmelderin beschrieben, deren Inhalt durch Bezugnahme vollständig aufgenommen wird.

15

35

Die erste Station 19 dient zur Übergabe der Wafer eines Transportbehälters an die Rollen. Hierzu ist im mit dem Bezugszeichen 20 (Fig. 2, 2a) bezeichneten Bereich das Übergabemodul vorgesehen mit dem die Wafer mittels eines Batch-20 Greifers aus jeweils der untersten Transportbox der Speicherzeile 7 entnommen und an die Rollen 17, 18 übergeben werden können. Eine Anlage, mit der dies ausgeführt werden kann, ist in der europäischen Patentanmeldung Nr. 97 107 352.3 vom 03.05.1997 der Anmelderin gezeigt. Auch der Inhalt dieser Anmeldung wird hiermit durch Bezugnahme vollständig aufgenommen.

Die zweite Station 21 dient zur Ausrichtung der Wafer in Bezug auf ihre rotative Orientierung um eine Längsachse 22 ei-30 nes Batches 23, sowie zur Detektierung von Fehlpositionierungen der Wafer im Halterechen. Die Rotationsposition von jedem der Wafer wird durch Detektierung einer an jedem Wafer vorhandenen Kerbe festgestellt. Als weitere Funktion ist eine Kamera 24 eingebaut, welche die Anzahl und die Position der Wafer überwacht.

Die dritte Station 25 ist mit einer Greifvorrichtung 28 versehen, die 25 einzeln und voneinander unabhängig betätigbare Einzelgreifer aufweist. Sämtliche Greifer sind an einem gemeinsamen Träger beweglich befestigt. Die als Halterechen dieser Station ausgebildete Lagereinrichtung ist gegenüber dem ortsfesten Träger zusätzlich auch parallel zum Wafer-Batch und den Rollen in X-Richtung linear verfahrbar. Die Verfahrwege des Halterechens betragen ganzzahlige Vielfache des Abstandes, den die nebeneinander angeordneten Wafer-Aufnahmen im Halterechen aufweisen. Um zu ermöglichen, dass jeder Greifer an sich jeden Wafer aus dem Halterechen entnehmen kann, sollte der Gesamtverfahrweg des Halterechens seiner doppelten Länge entsprechen. Auf den möglichen konstruktiven Aufbau einer solchen Greifvorrichtung wird nachfolgend noch näher eingegangen.

10

15

Mit der Greifvorrichtung 28 kann durch jeweils einen Greifer ein bestimmter Wafer aus dem Halterechen entnommen werden. Durch eine Relativbewegung zwischen dem Halterechen und der Greifvorrichtung parallel zur Batch-Achse 22 wird nachfol-20 gend ein anderer Greifer gegenüber dem nun zu entnehmenden Wafer angeordnet und der Wafer aus dem Halterechen herausgeführt. Dies wird solange durchgeführt, bis sämtliche Wafer des Batches von der Greifvorrichtung erfasst sind. Nachfolgend werden die Wafer von der Greifvorrichtung wieder in den 25 Halterechen eingesetzt. Soll die Position von einem oder mehreren Wafern unverändert bleiben, kann selbstverständlich auch vorgesehen sein, dass diese Wafer im Halterechen verbleiben und nur die zu vertauschenden Wafern entnommen wer-30 den.

Bei diesem Vorgang wird eine neue Reihenfolge der Wafer erzeugt, wobei die neue Reihenfolge davon abhängt, welcher Greifer welchen Wafer aus dem Halterechen entnimmt. Um die Verfahrwege des Halterechens möglichst kurz zu halten, sollte als jeweils nächster Greifer stets der Greifer zum Ein-

satz kommen, dessen zu greifender Wafer in der aktuellen Position der Greifvorrichtung den geringsten Abstand zu dem ihm zugeordneten Greifer hat. Welcher Wafer von welchem Greifer erfasst werden soll, kann bereits im Voraus durch eine vordefinierte Reihenfolge festgelegt werden. Es kann aber genauso möglich sein, dass die Reihenfolge durch einen Zufallsgenerator ermittelt wird.

Die vierte Station 40 befindet sich an einer Stirnseite einer Handhabungsvorrichtung 41 für Wafer, in der Wafer ausserhalb von Transportbehältern 6 oder Transportkassetten
zwischengelagert werden. Mit der Handhabungsvorrichtung 41
werden zudem Wafer-Batches, aus den in einer Lagereinrichtung 42, mit ihren Oberflächen vertikal und parallel zueinander, angeordneten, mehreren hundert Wafern, beispielsweise
600 Wafern, zusammengestellt.

Hierzu ist eine Greifvorrichtung 43 vorgesehen, die im Wesentlichen gleich aufgebaut sein kann, wie die Greifvorrichtung 28 der dritten Station 25. In den Fig. 3, 4 und 5 ist 20 ein erstes Ausführungsbeispiel einer solchen erfindungsgemässen Greifvorrichtung 43 gezeigt. Diese weist insgesamt 25 identische Greifer 44 auf, die an einem Träger 45 schwenkbar angelenkt sind. Jeder Greifer 44 ist mit einem bogenförmigen Schwenkarm 46 versehen. Eine Innenkante 47 des Schwenkarms 25 46 ist kreisbogenförmig ausgestaltet, erstreckt sich über einen Winkelbereich von ca. 200° und hat einen Radius, der geringfügig grösser ist, als der Radius eines zu greifenden Wafers 48. An einem freien Ende des Schwenkarms 46 sowie im Bereich der Anlenkung des Schwenkarms 46 am Träger 44, ist 30 jeweils ein Halteelement 49, 50 vorgesehen. Die beiden Halteelemente 49, 50 ragen jeweils über die Innenkante 47 hinaus und liegen - bezogen auf den von der Innenkante 47 gebildeten Bogen des Schwenkarms - um mehr als 180° auseinander. Desweiteren ist in etwa in der Mitte zwischen diesen 35 beiden Halteelementen 49, 50 ein passiv betätigbares weiteres Halteelement 51 angebracht, das in einer Endlage ebenfalls über die Innenkante 47 hinausragt. Die drei Halteelemente 49 - 51 liegen in einer gemeinsamen (imaginären) Ebene. Sie weisen an ihrem Umfang jeweils eine nicht gezeigte
umlaufende Nut auf, die zur Aufnahme eines Wafers 48 vorgesehen ist.

In Fig. 5 sind die beiden Endlagen dargestellt, die der Schwenkarm 46 eines Greifers 44 einnehmen kann. Um bei jedem Greifer eine individuelle Bewegung zu erzielen, können unterschiedliche konstruktive Lösungen vorgesehen sein, deren prinzipieller Aufbau nachfolgend kurz erläutert wird. In einer ersten Ausgestaltung weist die Greifvorrichtung einen zentralen Antrieb für sämtliche Greifer auf, wobei über ansteuerbare Kupplungen die einzelnen Greifer betätigt werden. In einer zweiten möglichen Ausgestaltung ist jeder Greifer mit einem separaten Antrieb, beispielsweise einem sehr schmal bauenden elektrischen "Voice-Coil-Motor" versehen. Jeder dieser Antriebe ist auch separat ansteuerbar.

20 Schliesslich ist es auch möglich, jeden Greifer über einzelne Zylinder, die aus Platzgründen auch zueinander versetzt

In der ersten unteren Endlage befindet sich der Schwenkarm
46 in einer Leerposition der Greifvorrichtung. In dieser Position ist der Greifer mit Abstand zu den in der Lagereinrichtung 42 befindlichen Wafern angeordnet. Auch die Halteelemente 49, 50 und 51 haben Abstand zu den Wafern, so dass
der Greifer 44 parallel zur Lagereinrichtung entlang der X30 Achse kollisionsfrei verfahrbar ist.

angeordnet sein können, zu betätigen.

Um einen Wafer aus der Lagereinrichtung zu entnehmen, ist der Greifer mit seinem Schwenkarm 46 zunächst in X-Richtung in einer Ebene anzuordnen, die mit der von einem Wafer gebildeten Ebene fluchtet. Nun kann der Schwenkarm 46 - in bezug auf die Darstellung von Fig. 5 - in Gegenuhrzeigerrich-

tung in seine Transportposition überführt werden. Bereits unmittelbar nach Beginn dieser Schwenkbewegung kommen die Halteelemente 49, 50 unterhalb einer Durchmesserlinie 54, die parallel zu einer Verbindungslinie 53 der beiden Kon-5 taktstellen der Halteelemente 49, 50 verläuft, in Anlage gegen den Wafer. Der Wafer wird dadurch vom Greifer erfasst und angehoben. Unmittelbar darauffolgend wird das Halteelement 51 passiv betätigt - beispielsweise durch eine Kurvenscheibe oder einen Anschlag - wodurch dieses auf den Wafer zugestellt wird und gegen dessen Seitenkante anliegt. Da-10 durch ist der Wafer im Greifer fixiert und wird, ohne Relativbewegungen gegenüber dem Greifer auszuführen, von letzterem in die Transportposition mitgenommen. Der Schwenkarm schwenkt bei seiner Bewegung von einer Endlage in die andere um ca. 75°. Auch in der Transportposition ist der Greifer -15 und selbstverständlich auch der darin befindlichen Wafer mit Abstand zur Lagereinrichtung und deren Wafern angeordnet. Der Greifer 44 kann somit auch in dieser Endlage kollisionsfrei in X-Richtung entlang der Lagereinrichtung verfah-20 ren.

Sobald der Schwenkarm 46 die Transportposition erreicht hat, ist der Greifvorgang abgeschlossen. Die Greifvorrichtung kann nun parallel (in X-Richtung) zum Waferstapel verfahren werden, um mit einem anderen Greifer in prinzipiell gleicher Weise den nächsten Wafer aus der Lagereinrichtung 42 zu entnehmen. Dies wird mit jeweils weiteren anderen Greifern solange wiederholt, bis sämtliche zu erfassenden Wafern aus der Lagereinrichtung entnommen und in der Greifvorrichtung angeordnet sind.

Nachdem einer der Greifer mit dem letzten zu greifenden Wafer in seine Verfahrposition geschwenkt worden ist, kann die
Greifvorrichtung zur Transferstation verfahren werden, deren
35 Halterechen 37 Aufnahmen für sämtliche Wafer eines WaferBatches aufweist. Die in der Greifvorrichtung angeordneten

Wafer werden nun an den Halterechen 37 übergeben. Hierzu wird die Greifvorrichtung zunächst neben dem Halterechen angeordnet, so dass jeder Wafer mit einer Aufnahme des Rechens fluchtet. Anschliessend werden sämtliche einen Wafer 48 haltenden Schwenkarme 46 von ihrer Transportposition in ihre Leerposition gleichzeitig geschwenkt. Am Ende der Schwenkbewegung sind die Wafer jeweils in einer Aufnahme angeordnet und befinden sich ausserhalb der Nuten der Halteelemente 49, 50. Bei dieser Bewegung wird auch das Halteelement 51 durch passive Betätigung in seine Freigabeposition zurückgeschwenkt. Dieser Vorgang ist in Fig. 3agezeigt.

Durch Absenken des Halterechens kann nun das neu zusammengestellte Wafer-Batch an die bis dahin darunter angeordneten 15 Rollen 17, 18 übergeben werden, die nachfolgend das Batch an eine der anderen drei Stationen zur weiteren Handhabung überführt.

Ein Wafer-Batch, das von den Rollen 17, 18 in die Transfer-20 Station 40 gebracht wird, kann in umgekehrter Reihenfolge von der Transfer-Station in die Lagereinrichtung eingesetzt werden. Hierzu werden als erstes sämtliche Wafer 48 des Batches gleichzeitig von einem der Greifer erfasst und jeweils in die Transportosition geschwenkt. Anschliessend wird jeder 25 Greifer der Greifvorrichtung vor eine Aufnahme der Lagereinrichtung positioniert und der jeweilige Wafer an die Lagereinrichtung übergeben. Hierbei können die Wafer sowohl als gesamtes Batch gleichzeitig oder einzeln nacheinander in die Lagereinrichtung eingesetzt werden. Selbstverständlich ist 30 es auch möglich, eine Anzahl von mehreren Wafern an die Lagereinrichtung 42 gleichzeitig zu übergeben, die kleiner ist als ein Batch. In diesem Fall sind anschliessend die restlichen Wafer - wiederum gleichzeitig oder gruppenweise gemeinsam - in die Lagereinrichtung einzusetzen. Unabhängig davon, in welcher Reihenfolge die Wafer in die Lagereinrichtung eingesetzt werden, wird in einem Speicher einer nicht darge-

stellten Steuerung der Handhabungsvorrichtung gespeichert, an welcher Position der Lagereinrichtung jeder Wafer eingesetzt ist. Für jeden Wafer können zusätzlich auch Informationen darüber gespeichert werden, welche Prozesse er an welcher Position im Batch bisher durchlaufen hat und welche Prozesse noch zu absolvieren sind.

In Fig. 3 weisen nebeneinanderliegende Aufnahmen der in dieser Darstellung nur mit einer Teillänge gezeigten Lagereinrichtung 42 einen Abstand auf, der kleiner ist, als der übliche Abstand von Wafern in Transportbehältern (sogenannter "Pitch") und als der Abstand, den nebeneinanderliegende Schwenkarme der Greifvorrichtung aufweisen. So kann der Abstand der Aufnahmen beispielsweise die Hälfte oder ein Drittel des üblichen Pitches sein. Sollen sämtliche nebeneinan-15 derliegenden Aufnahmen gefüllt werden, muss somit die Greifvorrichtung jeweils zwischen zwei bereits in der Lagereinrichtung befindliche Wafer ein oder mehrere weitere Wafer einsetzen. Dadurch kann eine Verdichtung des in der Lagereinrichtung angeordneten Wafer-Stapels erzielt werden, wodurch die für eine bestimmte Anzahl an Wafern erforderliche Länge der Lagereinrichtung reduziert werden kann.

Die erfindungsgemässe Greifvorrichtung kann konstruktiv auch auf andere Weise als in den Fig. 3 bis 5 gezeigt, ausgebildet sein. Wie in Fig. 6 dargestellt ist, kann beispielsweise ein Greifer 60 einer erfindungsgemässen Greifvorrichtung auch in Z-Richtung linear verfahrbar sein, um einen Greifer 60 von seiner Leerposition in seine Transportposition und vice versa zu überführen. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist ein Träger 61 vorgesehen, der an einer unter der Lagereinrichtung 42 angeordneten Führungsschiene 62 linear und in X-Richtung parallel zu dem Wafer-Stapel bzw. der Lagereinrichtung 42 verfahrbar ist. Der Träger 61 umgreift die Lagereinrichtung und weist auf beiden Seiten der Lagereinrichtung 42 einen vertikal verfahrbaren und längs einer



Vertikalen verlaufenden Teleskop-Greifarm 63, 64 auf. An einem freien Ende jedes Greifarmes 63, 64 ist jeweils ein zu dem anderen Greifarm weisendes Greifelement 65, 66 vorgesehen, das zur Aufnahme eines Wafers 48 mit einer Nut versehen ist. Die beiden Greifarme 63, 64-eines Greifers führen sämtliche Bewegungen gleichzeitig und synchron aus. Die Greifvorrichtung kann eine Anzahl an derart aufgebauten und voneinander unabhängig betätigbaren Greifern 60 aufweisen, die dem grössten zu handhabenden Wafer-Batch entspricht. Die Betätigung der Greifer kann beispielsweise durch einzelne Pneumatikzylinder, durch einzelne Voice-Coil-Motoren oder durch einen zentralen, an jeden Greifer separat ankuppelbaren, Motor vorgenommen werden. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel sind sämtliche Greifer 60 gleichzeitig linear und parallel zur Längserstreckung der Lagereinrichtung (X-Richtung) verfahrbar.

10

15

Die Greifer sind in beiden Endlagen gemeinsam in X-Richtung verfahrbar. In einer unteren, in Fig. 6 mit durchgezogenen Linien dargestellten Leerposition, befinden sich die beiden Greifelemente unterhalb einer horizontalen Durchmesserlinie 67 der Wafer 48, so dass die Greifelemente 65, 66 mit Abstand zu den Wafern angeordnet sind. Ist der Greifer mit seinen Greifelementen 65, 66 in X-Richtung auf der Position eines Wafers 48 angeordnet und werden die Greifarme 63, 64 25 von der unteren in die obere Endlage überführt, so wird hierbei der jeweilige Wafer erfasst und nach oben aus der Lagereinrichtung herausgeführt. In der oberen Verfahrposition ist der jeweilige Wafer 48 in Bezug auf eine Z-Richtung mit Abstand zu den in der Lagereinrichtung 42 befindlichen 30 Wafern angeordnet. Somit ist jeder Greifer in seinen beiden Endlagen in X-Richtung parallel zur Lagereinrichtung verfahrbar.



Patentansprüche

- Handhabungsvorrichtung für Wafer (Halbleiterscheiben), 1. welche eine Lagereinrichtung aufweist, in der mehrere Wafer mit ihren Oberflächen im wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet, hintereinander und ausserhalb eines Transportbehälter anordenbar sind, mit einer Greifvorrichtung versehen ist, mit welcher einzelne Wafer aus 10 der Lagereinrichtung entnehmbar und/oder in sie einsetzbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Greifvorrichtung (43) mehrere Greifer (44, 60) aufweist, welche gemeinsam verfahrbar jedoch unabhängig voneinander betätigbar sind, wobei durch die Betätigung eines Greifers 15 (44, 60) jeweils zumindest ein Wafer erfassbar und/oder in die Lagereinrichtung einsetzbar ist.
 - 2. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Greifer der Greifvorrichtung, der Anzahl an Wafern eines Waferbatches oder einem ganzzahligem Vielfachen davon entspricht.

20

25

30

- 3. Handhabungsvorrichtung nach einem oder beiden der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
 Greifer der Greifvorrichtung an einem gemeinsamen
 Schlitten angeordnet sind, welcher an einem Führungselement parallel zur Lagereinrichtung verfahrbar ist.
- 4. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Greifer in zwei Endlagen schwenkbar sind, wobei sie sich in einer ersten Endlage in einer Leerposition und in einer zweiten Endlage in einer Transportposition für Wafer der Greifvorrichtung befinden, in welcher sie Wafer im wesentlichen parallel zur Lagereinrichtung transportieren.



- 5. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkbewegung des Greifers in einer
 Ebene stattfindet, welche im Wesentlichen orthogonal zur
 Verfahrrichtung der Greifvorrichtung und parallel zu den
 Oberflächen der Wafer der Lagereinrichtung ausgerichtet
 ist.
- 6. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Greifer der Greifvorrichtung, unabhängig von anderen Greifern der Greifvorrichtung, im Wesentlichen parallel zu den Oberflächen der Wafer und quer zur Verfahrrichtung der Greifvorrichtung geradlinig bewegbar sind, wobei sie sich in einer ersten Endlage in einer Leerposition und in einer zweiten Endlage in einer Transportposition für Wafer der Greifvorrichtung befinden, in welcher sie Wafer im wesentlichen parallel zur Lagereinrichtung transportieren.
- 7. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet dass in die Lagereinrichtung eine Anzahl an Wafern einsetzbar ist, die zumindest im wesentlichen einem ganzzahligem Vielfachen der Anzahl an Wafern entspricht, die durch die Greifvorrichtung gleichzeitig handhabbar ist.
- 8. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine im Verfahrweg der Greifvorrichtung angeordnete TransferStation mit einem Zwischenlager für Wafer, in dem mehrere Wafer mit ihren Oberflächen parallel zueinander angeordnet werden können, wobei mit der Greifvorrichtung Wafer von der Lagereinrichtung zur Transfer-Station und
 umgekehrt überführbar sind.
 - 9. Greifvorrichtung zur Handhabung mehrere Wafer, die mehrere Greifer für jeweils einen Wafer aufweist, wobei die Wafer in den Greifern parallel zueinander angeordnet

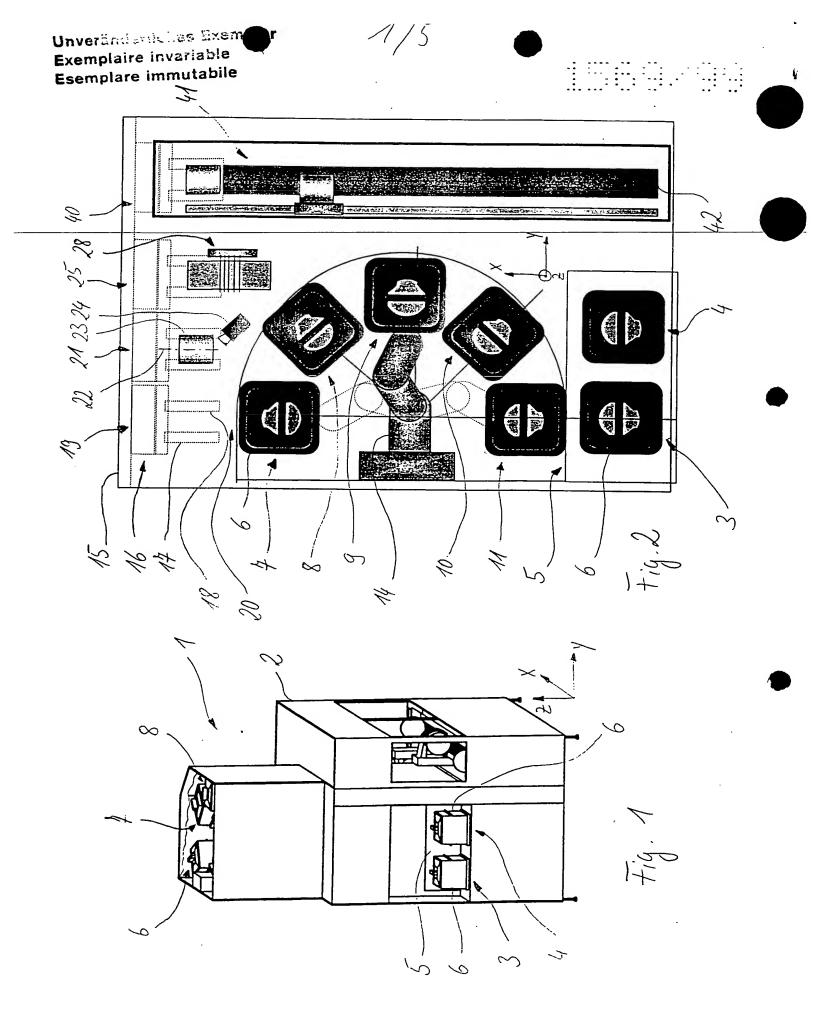
werden können, die Greifer gemeinsam verfahrbar jedoch unabhängig voneinander betätigbar sind, und durch die Betätigung eines Greifers jeweils zumindest ein Wafer handhabbar ist.

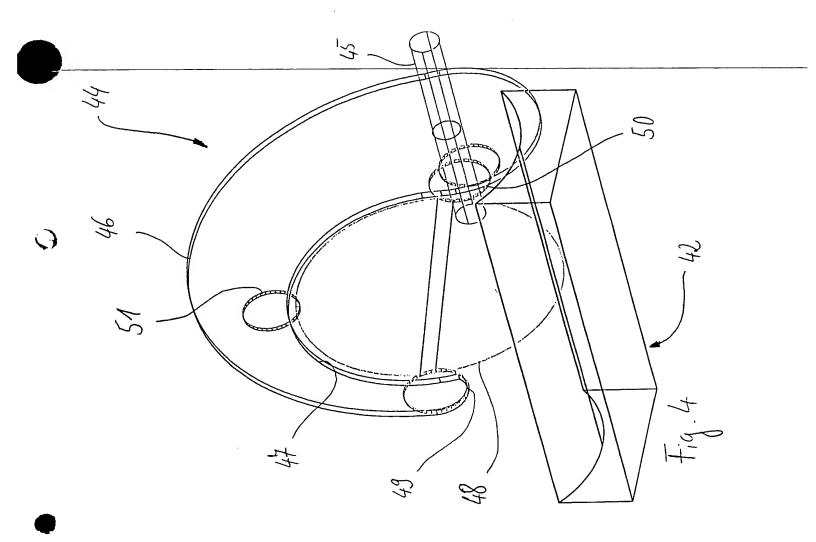
- 10. Speichervorrichtung für eine Zwischenlagerung von Wafern, die ein Gehäuse aufweist, das einen Innenraum ausbildet in dem mehrere Speicherplätze für Transportbehälter von Wafern vorhanden sind, die Speichervorrichtung mit einem Manipulator versehen ist, der die Transportbe-10 hälter handhabt, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil des Innenraumes als Reinraumbereich ausgebildet ist, in dem Wafer ausserhalb von Transportbehältern handhabbar und in einer Lagereinrichtung zwischenlagerbar sind, und zumindest eine Greifvorrichtung vorhanden ist, die mehrere Greifer aufweist, welche gemeinsam ver-15 fahrbar jedoch unabhängig voneinander betätigbar sind, wobei durch die Betätigung eines Greifers jeweils zumindest ein Wafer erfassbar und/oder in die Lagereinrichtung einsetzbar ist.
- 20 11. Speichervorrichtung nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch eine Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 8.
- 12. Verfahren zur Zusammenstellung eines Waferbatches, bei welchem zunächst Wafer von zumindest einem Wafer-Batch in einer Lagereinrichtung als Waferstapel angeordnet werden, nachfolgend mit einer Greifvorrichtung einzelne Wafer aus dem Stapel entnommen und in einer vorbestimmten Reihenfolge in einer Halteeinrichtung angeordnet werden, dadurch gekennzeichnet, dass mit einer Greifvorrichtung nacheinander mehrere Wafer aus der Lagereinrichtung entnommen und erst danach die entnommenen Wafern von der Greifvorrichtung an eine Halteeinrichtung übergeben werden.

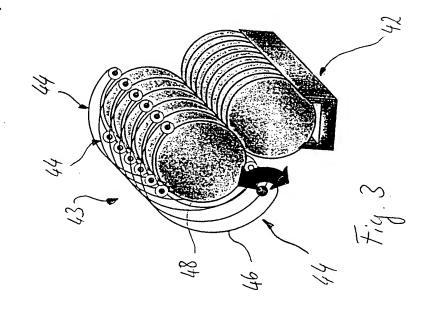


13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Greifvorrichtung Wafer eines in einer Übergabestation angeordneten Waferbatches erfasst, die Wafer an Lagerstellen der Lagereinrichtung absetzt und die Positionen von jedem der Wafer in der Lagereinrichtungen zusammen mit Daten zur Identifizierung des Batches, in dem sich der Wafer zuvor befand und/oder Daten bezüglich von dem jeweiligen Wafer bereits durchlaufenen Bearbeitungsprozessen speichert.

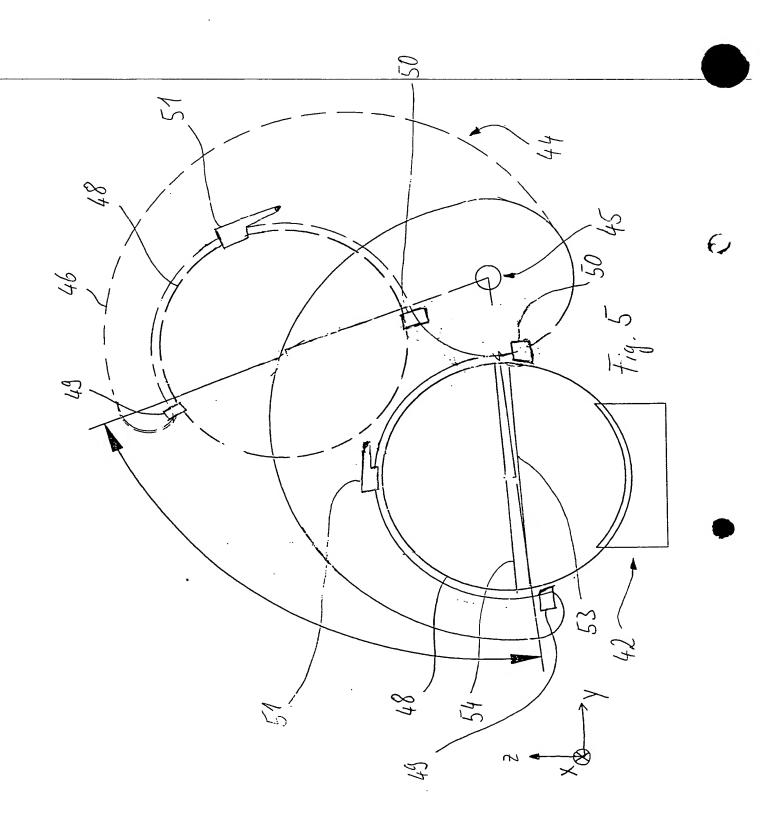
10

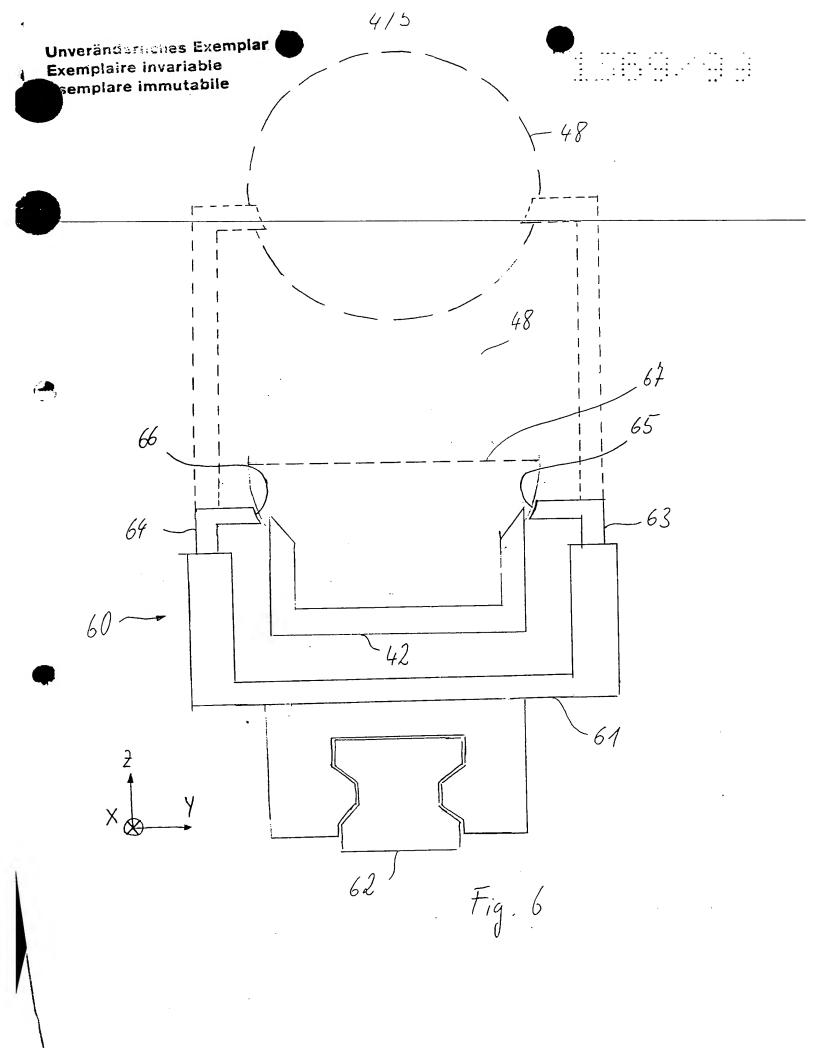






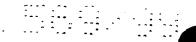
Unversing and the Exemplar Exemplaire invariable Esemplare immutabile

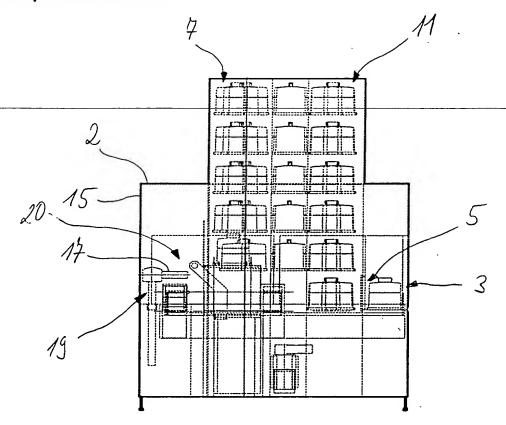




5/5

Unveränderliches Exemplar Exemplaire invariable Esemplare immutabile





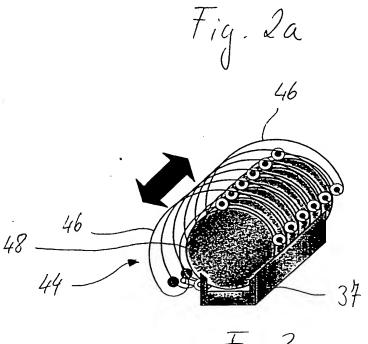


Fig. 3a